

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成22年12月9日 (2010.12.9)

【公開番号】特開2009-98044(P2009-98044A)

【公開日】平成21年5月7日 (2009.5.7)

【年通号数】公開・登録公報2009-018

【出願番号】特願2007-270963(P2007-270963)

【国際特許分類】

G 0 1 B 11/24 (2006.01)

G 0 1 C 3/06 (2006.01)

G 0 1 S 17/48 (2006.01)

【F I】

G 0 1 B 11/24 K

G 0 1 C 3/06 1 1 0 A

G 0 1 C 3/06 1 4 0

G 0 1 S 17/48

【手続補正書】

【提出日】平成22年10月15日 (2010.10.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

スリット光を被検物に照射し、該被検物からの反射光を光電変換して信号を検出する信号検出部の検出結果に基づいて前記被検物の形状を測定する形状測定装置であって、

前記被検物に第 1 のスリット光を照射する第 1 の照射手段と、

前記被検物に前記第 1 のスリット光よりもコヒーレンス性の高い第 2 のスリット光を照射する第 2 の照射手段と

を備え、

前記信号検出部による前記第 1 のスリット光の信号と、前記信号検出部による前記第 2 のスリット光の信号との少なくとも一方の前記信号を用いて、前記被検物の形状を測定する

ことを特徴とする形状測定装置。

【請求項 2】

前記信号検出部として、前記第 1 のスリット光が照射された前記被検物の部位と、前記第 2 のスリット光が照射された前記被検物の部位の像を撮像する撮像部を

備えることを特徴とする請求項 1 に記載の形状測定装置。

【請求項 3】

前記第 1 の照射手段がLED(Light Emitting Diode)を含み、

前記第 2 の照射手段がSLD(Super Luminescent Diode)を含む

ことを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載の形状測定装置。

【請求項 4】

前記第 1 の照射手段と前記第 2 の照射手段によるスリット光の照射タイミングを制御する制御手段を

さらに備えることを特徴とする請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載の形状測定装置。

【請求項 5】

前記第 1 のスリット光による信号と前記第 2 のスリット光による信号とのうちの一方に異常がある場合に、前記第 1 のスリット光による信号と前記第 2 のスリット光による信号とのうちの他方の信号を用いて、前記被検物の形状を測定する

ことを特徴とする請求項 1 から請求項 4 のいずれか 1 項に記載の形状測定装置。

【請求項 6】

前記第 1 のスリット光の照射方向と前記第 2 のスリット光の照射方向とが調整可能である

ことを特徴とする請求項 1 から請求項 5 のいずれか 1 項に記載の形状測定装置。

【請求項 7】

前記第 1 の照射手段と前記信号検出部との間隔と、前記第 2 の照射手段と前記信号検出部との間隔とが調整可能である

ことを特徴とする請求項 1 から請求項 6 のいずれか 1 項に記載の形状測定装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 8】

本発明の形状測定装置は、スリット光を被検物に照射し、該被検物からの反射光を光電変換して信号を検出する信号検出部の検出結果に基づいて前記被検物の形状を測定する形状測定装置であって、前記被検物に第 1 のスリット光を照射する第 1 の照射手段と、前記被検物に前記第 1 のスリット光よりもコヒーレンス性の高い第 2 のスリット光を照射する第 2 の照射手段とを備え、前記信号検出部による前記第 1 のスリット光の信号と、前記信号検出部による前記第 2 のスリット光の信号との少なくとも一方の前記信号を用いて、前記被検物の形状を測定することを特徴とする。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 9

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 0

【補正方法】削除

【補正の内容】